



## мв и ссо рефср

# УРАЛЬСЧИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ имени С. М. КИРОВА

физико-технический факультет Кафедра теоретической физики

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

на тему	Особенности нелинейного ферромагнитного на незакреплённых образиах.	C
резона	нса на незакреплённых образцах.	
	Дипломант Широносов В.Г. Пиф	
	Зав. кафедрой Нурбатов ЛВ. Мит	
	Руководитель Вилатов АИ. Вильтор	,
	Консультанты Чайка А.И. вили	
	Оспанов А.У.	

# СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	2
Глава I. ВЛИЯНИЕ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ СИЛЫ И КРИСТАЛЛО- ГРАФИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ НА СВОЙСТВА НЕЛИНЕЙ- НОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА § I. Расчет магниторезонансной силы с помощью	
приближенных решений модифицированного урав- нения Блоха	5
зонансной силы в экспериментах:	0
а) Неоднородность подмагничивающего поля	8 10
б) Неоднородность СВЧ-поля	II
§ 3. Учет влияние кристаллографической анизотропии	
на свойства НФМР	IB
§ 4. Учет нагрева образца	16
Глава 2. РАСЧЕТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА РАБОТЫ НА НЕЙ.	
§ І. Блок-схема установки	
I. Система управления полем	20
2. Cистема CBY	23
линии поглощения	26
4. Система наблюдения магнитоакусти ческого	
резонанса	26
работы с ними	29
Глава З. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА	
§ I. Измерение нижнего порога величины магниторезо-	
нансной силы по разрыву двух диполей	31
§ 2. Механизм возбуждения магнитоакустических	20
колебаний	32 35
	0,5
§ 4. Зависимость формы линии поглощения от времени	4I
развертки по полю	44
JUTEPATYPA	45

#### введение

Опыты, которые будут описаны ниже, мы провели в надежде выяснить физическую причину некоторых особенностей нелинейного ферромагнитного резонанса (НФМР).

Областью исследования НФМР является изучение свойств ферритов в сильных сверхвысокочастотных (СВЧ) полях, когда связь между компонентами намагниченности и полем становится нелинейной. Нелинейный процесс приводит к сложным превращениям с возникновением частиц различного сорта, например, магнонов и фононов. Тогда из опыта удается определить основные характеристики их взаимодействия, в частности, магнито упругие константы при возбуждении невырожденных магнитоупругих колебаний на частоте механического резонанса образца кристалла. Такой эффект впервые наблюдался в опытах Спенсера и Ле-Кроу [ 1 ] в 1958 году и был назван магнитоакустическим резонансом (МАР). В их опыте испольвовалась полированная сфера монокристалла  $Y_3$  Fe,  $C_6$ , диаметром 0,36 мм, которая свободно лежала на дне кварцевой пробирки в  $\omega_o=2\pi\cdot 9330$  Мгц. Кристалл помещался в резонаторе частоты мучность магнитного поля и намагничивался в направлении, попереч ном силовым линиям поля. Ширина линии ФМР кристалла составляла 0,5 э, а добротность резонатора  $Q_p \cong 500$ . Когда мощность волны СВЧ, поступавшей в резонатор, превышала 4 мвт, на выходе резонатора возникали интенсивные колебания с частотой

 $\omega_{akycm}$  = 2 $\pi$  •8,966 Мгц. Эта частота соответствовала упругот резонансу образца кристалла с точностью до нескольких процентов Подмагничивающее поле в опыте подбиралось так, чтобы резонанс однородной прецессии имел место при частоте  $\omega = \omega_e - \omega_{akycm}$  оно было равно 3277 э. При увеличении уровня накачки выбор величины поля подмагничивания становился менее критичным, так при мощности 80 мвт, оксионный эффект, наблюдался при

изменении поля подматничивания вблизи исходного значения на 30 э. Одновременно наблюдалось затягивание частоты возбужденного упругот колебания на величину до 20 Кгц. Многочисленными проверками (зависимости частоты CCakgem от объема образца кристалла, пороговой мощности, от механической нагрузки образца и др.) вполне убедительно показано, что колебания возбужденные на частоте CCakgem действительно были упругими. Механическая добротность образца оказалась равной CCakgem.

Бурков, Вашковский и Кильдышев [2] наблюдали сильный гистерезис по полю для возбуждения МАР в сферических образцах монокристаллов У и У Gd -гранатов, которые свободно помещались в короткозамкнутый волновод на расстоянии половины длины волны от поршня. Ширина линии ФМР монокристаллов и диаметр образцов соответственно были равны 2  $\Delta H = 1,2;0,5$  э и  $\Delta = 0,68;1,34$  мм Возбуждение колебаний МАР происходило только в том случае, если при заданной, (достаточной для возбуждения) мощности накачки пеперестройка по полю происходила в сторону увеличения подмагничивающего поля, при уменьшении подмагничивающего поля возбуждение колебаний, как правило, не происходило, только иногда происходил короткий по времени всплеск колебаний. Возбуждение же колебаний при изменении мощности и при постоянном подмагничи вающем поле H=const не происходило.

Иногда возникали медленные пульсации внутри областей возбужде ния МАР. Частота пульсаций, обычно падала с ростом мощности накачки до десятых долей герца от 2-3 гц. В момент возбуждения МАР происходил сдвиг резонансной кривой в сторону меньших частот. Такой сдвиг объяснялся тем, что возникающие упругие колебания, из-за нелинейной зависимости деформации от напряженности поля,

вследствии явления магнитострикции создают некоторое постоянное магнитное поле. Появление такого поля приводит к сдвигу резонансной частоты:

$$\omega_{peg} = \chi(H_o - \delta H_{\frac{3}{2}} \varphi_0)$$

где S Нэф. < O.

В экспериментальных работах  $\mathcal{L}$  **т** 4 $\mathcal{L}$  было установлено, что характер МАР возникающего при НФМР сильно зависит от подмагничивающего поля  $\mathcal{H}$ , амплитуда СВЧ поля  $\mathcal{H}$  и температуры  $\mathcal{L}$ .

В работах, посвященных теории НФМР [5 + 7], были предложены модели для объяснения явлений НФМР. Но, в целом, проблема возбуждения МАР и нестабильности НФМР остается открытой, в частности, неясна причина сильной анизотропии свойств магнитоакустических колебаний в почти изотропных кубических ферромагнетиках.

В настоящее время число работ, посвященных НФМР, увеличилось. Примером тому служит появление раздела под рубрикой "ФМР" и в нем пункта — "Нелинейные явления в "Реферативном журнале — Физика" (РЖФ) за 1975 год. Но ни в одной из просмотренных работ [I  $\div$  II] не учитывалось влияние неоднородностей по полю, ведущих к возник— новению магниторезонансной силы (МРС). Поэтому в настоящей работе ставилась задача обнаружить и исследовать влияние МРС на свойства НФМР, возникающей вследствие неоднородности : полей  $\overrightarrow{H}(\overrightarrow{z})$ ,  $\overrightarrow{h}(\overrightarrow{z})$  и поля создаваемого фиктивными магнитными отображениями образца в полюсных наконечниках магнита, а также выяснить влияние кристаллографической анизотропии на форму линии поглощения НФМР для незакрепленных образцов.

- ГЛАВА І. ВЛИЯНИЕ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ СИЛЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИ-ЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПИИ НА СВОЙСТВА НЕЛИНЕЙНОГО ФЕРРОМАТНИТНОГО РЕЗОНАНСА
  - § I. Расчет магниторезонансной силы с помощью приближенных решений модифицированного уравнения Блоха

В случае наблюдения НФМР на незакрепленных образцах воздействие любой силы может привести к пространственному перемещению образцов, что сильно повлинет на наблюдаемые свойства НФМР.

Рассчитаем силу  $\overline{F}$ , действующую на единицу объема образца, который помещен в поле  $\overline{H}$ , перпендикулярно которому приложено СВЧ поле  $\overline{h}$  поляризованное по правому кругу (см.рис.I).

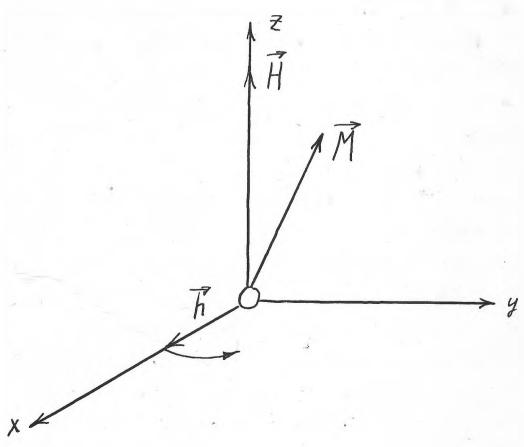


Рис. І.

Тогда энергия единицы объема образца в поле  $\widetilde{\mathcal{H}}$  будет равна:

$$U = -MH \tag{I.I}$$

где М - намагниченность.

Соответственно сила

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U = \vec{\nabla} (\vec{M} \cdot \vec{H}) \tag{I.2}$$

гле

 $M = M(\overline{H}(\overline{z}), \overline{h}(\overline{z}), \{\overline{L}_{i,j}(\overline{z})\} \} = M(\overline{z})$ 

 $\{\mathcal{L}_{G}(\overline{z})\}$  — ряд других параметров, от которых может зависеть M при учете НФМР.

Для нахождения резонансной зависимости  $\widetilde{\mathcal{M}}$  от параметров решим модифицированное уравнение Блоха .

Рассмотрим модель изотропного бесконечного ферромагнетика, тогда  $\Gamma$ II]

$$\frac{\partial M}{\partial t} = -y \left[ M \times H \right] - \omega_z \left( M - \chi_o H + \right)$$
 (1.3)

где

 $Hell = \{hcosut + H_x, hsinwt + H_y, H_z\}$   $y_o = M_o/H$  — статическая магнитная восприимчивость;  $cc_z = fAsH$  — частота релаксации; -f = fe — гиромагнитное отношение для электрона.

Переход во вращающуюся систему координат с частотой  $\overline{w}$  приводит уравнение (1.3) к виду

Будем считать, что  $H_2 > 7 H_K$ ,  $H_y$  и пренебрегая вкладом поперечных компонент, получим в стационарном случае:

$$M_{\chi} \beta = \frac{\chi_{o} h(\omega_{z}^{2} + j^{2}h^{2} - \lambda \omega_{f} H_{z})}{\omega_{z}^{2} + j^{2}h^{2} + \lambda \omega^{2}},$$

$$M_{\chi} \beta = -\frac{\omega_{z} \chi_{o} h(\lambda \omega + j H_{z})}{\omega_{z}^{2} + j^{2}h^{2} + \lambda \omega^{2}},$$

$$M_{z} \beta = \frac{\chi_{o} (\omega_{z}^{2} H_{o} - \lambda \omega_{f} h^{2} + \lambda \omega^{2} H_{z})}{\omega_{z}^{2} + j^{2}h^{2} + \lambda \omega^{2}},$$

где

Будем рассматривать решение в областях, где выполняются условия

$$\Delta \omega > \frac{h^2}{H_z^2} \gamma H_z$$

$$\Delta \omega > \frac{\omega_z^2}{\gamma H_z}$$

$$\Delta \omega < \frac{\omega_z^2}{J^2 h^2} \gamma H_z$$

Заменим УоН => Мо - намагниченность насыщения

Тогда:

$$M_{\chi} \ell = -\frac{\Delta \omega \cdot fh}{\omega_z^2 + f^2 h^2 + \Delta \omega^2} M_0;$$

$$M_{\chi} \ell = -\frac{\omega_z fh}{\omega_z^2 + f^2 h^2 + \Delta \omega^2} M_0;$$

$$M_{\xi} \ell = \left(1 - \frac{f^2 h^2}{\omega_z^2 + f^2 h^2 + \Delta \omega^2}\right) M_0$$

$$(I.5)$$

Выражение для силы (1.2) примет в общем случае вид:

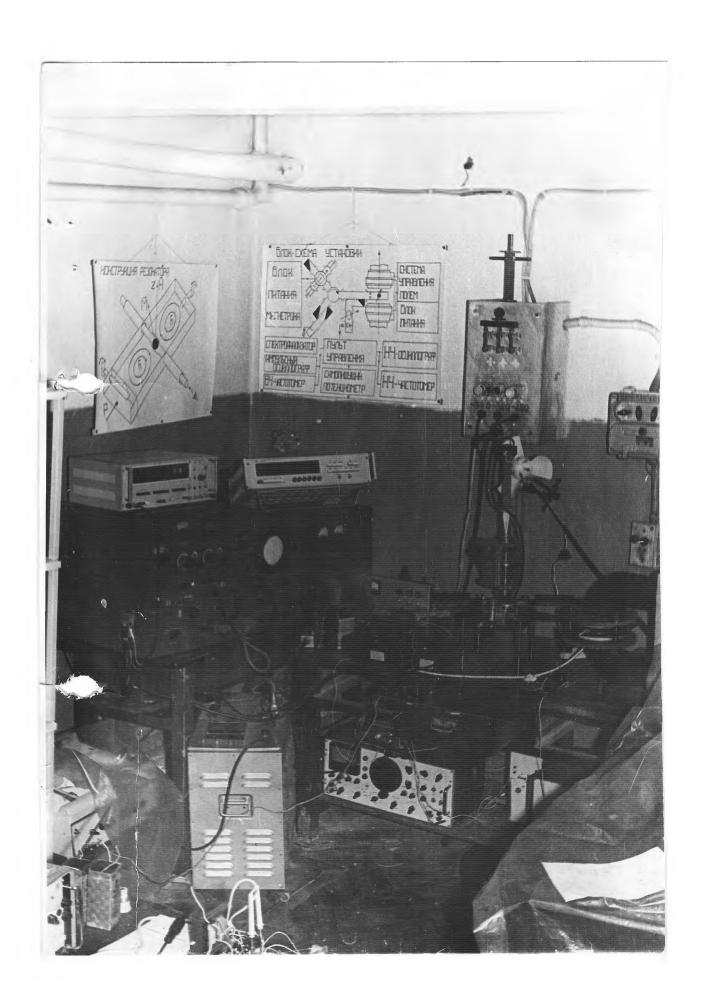
$$\vec{F} = \vec{F}_{H} + \vec{F}_{M} \tag{I.6}$$

-где 
$$F_H = F_H \cdot M$$

- сила, связанная с изменением поля в пространстве

- сила, связанная с изменением магнитного момента;

- тензоры градиентов поля и магнитного момента:



# § 2. Причины приводящие к возникновению магниторезонансной силы. в экспериментах

а) Неоднородность подмагничивающего поля

Полированные сферы монокристаллов, применяемые для экспериментальных исследований, по своим магнитным свойствам аналогичны бесконечной изотропной среде, с точки зрения граничных условий  $\begin{bmatrix} 11 \end{bmatrix}$ . Поэтому можем непосредственно оценивать величину МРС для таких образцов с условием, что изменение поля H в пределах образца много меньше ширины линии ФМР. Тогда, используя выражение  $\begin{bmatrix} 1.5 \end{bmatrix}$  для решения уравнения  $\begin{bmatrix} 1.2 \end{bmatrix}$  в поле

 $Heff = \{hcoswt - \frac{ax}{2}; hsinwt - \frac{ay}{2}; Ho + az\}$  где d>0 и учтено условие dioH=0, получим:

$$F_{z} = \alpha M_{o} \left( \frac{2 H_{o} h^{2}}{\Delta H_{eff}^{3}} \right) \cdot \frac{\alpha z / \Delta H_{eff}}{\left[ 1 + \left( \alpha z / \Delta H_{eff} \right)^{2} \right]^{2}} \tag{I.7}$$

где  $co=fH_o$ ,  $\Delta Heff=\overline{\Delta H^2+h^2}$  — эффективная полуширина линии НФМР, так как  $F_{X,y}/F_2 \approx h/H_o \Longrightarrow F_{X,y} \approx 0$ 

Сравним величину MPC в силой тяжести  $F_{\tau} = -. \rho g$  тогда

$$f = \left| \frac{F_2}{F_T} \right|; f_{max} = f \Big|_{\substack{az \\ \Delta Heff}} = \frac{0,648 \frac{aM_0}{Pg} \left( \frac{H_0 h^2}{A Heff^3} \right)}{A Heff^3}$$
 (I.8)

где Р - удельная плотность;

9 - ускорение свободного падения.

Введем обозначения:

 $F_{H} = a M_{o}$  - сила, связанная с изменением поля в

$$K = \frac{H_0 h^2}{\Delta H_{eff}^3}$$
:0,648 пространстве; коэффициент усиления  $F_H$ .

Количественные оценки для образца монокристалла лают значение:

дают значение:
$$\int_{max} = \frac{0.648 \cdot \frac{1750u}{4\pi} \cdot 1^{3}/cu}{5.17^{3}/cu^{3}} \cdot 980 \, \text{см/cex} \, \frac{3300 \cdot (0.43)}{(0.45 \cdot )^{3}} \approx 1480$$
соответственно
$$K = 4.000$$

То-есть, за счет магнитного резонанса можно увеличить силу обычного магнитного притяжения в 4000 раз. Даже при неодно родности внешнего поля  $a \ll \frac{A}{a}$  влияние мРС на НФМР на незакрепленных и закрепленных образцах существенно. Например, при неоднородности H

$$a = 10^{-3} \frac{\Delta H}{d}$$
,  $f_{max} = 2,68$ .

Расстояние между max и min значением  $\frac{F_2}{F_T}$  составляе в единицах по полю (см.рис.2)

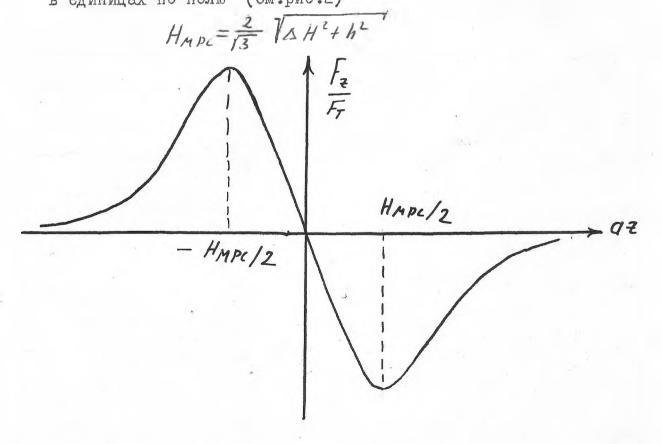


Рис. 2. График зависимости МРС от поля.

В проводимых экспериментальных работах неоднородность внешнего поля // может быть обусловлена влиянием конечных размеров полюсных наконечников магнита. Величина неоднородности возрастает по мере удаления от центра полюсных наконечников [12] Так, для зазора между полюсами 20,40 мм неоднородность поля может достигать 0,5; 1,5 э/см. в центральной области, что сущест венно повлияет на наблюдение НФМР для незакрепленных образцов.

#### б) Неоднородность СВЧ поля.

При исследовании НФМР в резонаторе или в короткозамкнутом волноводе (Рис.3) возникают стоячие волны, что приводит к зависимости  $h(\bar{\tau})$ . Например, для резонатора  $H_{(0)}$  распределение полможно записать в виде:

$$E_{z} = E_{zo} \sin \frac{\pi}{a} y \cdot \sin \frac{2\pi}{\lambda e} x \mid E_{y} = E_{x} = 0$$

$$\mathcal{H}_{y} = \mathcal{H}_{yo} \sin \frac{\pi}{a} y \cdot \cos \frac{2\pi}{\lambda e} x \mid \mathcal{H}_{z} = 0$$

$$\mathcal{H}_{x} = -i \mathcal{H}_{xo} \cos \frac{\pi}{a} y \cdot \cos \frac{2\pi}{\lambda e} x \mid \mathcal{H}_{xo} = 2h$$

Для образца, расположенного в точке  $(\frac{G}{2}, \frac{h}{2}, \frac{\lambda b}{2} + \Delta x)$  имеем (I.6)

где  $\Delta X$  — неточность выставления образца в центре резонатор Тогда, проводя вычисления аналогичные (а), получаем:

$$f_h = \left| \frac{F_{Xh}}{F_T} \right| = \frac{4\pi M_0 H_0}{\lambda e \rho g} \frac{\omega_z^2 f^2 h^2}{(J^2 h^2 \cos^2 \frac{\pi}{J_e} \Delta x + \omega_z^2)^2} / \sin^2 \frac{\pi}{J_e} \Delta x \cdot \cos^2 \frac{\pi}{J_e} \Delta x /$$

$$\text{Для } \Delta x = \text{IO}^{-1} \text{ cm}; \lambda \theta = 4 \text{ cm}; f_h = \omega_z = 0.56 \text{ мгц};$$

$$4\pi M_0 = 1450 \text{ zcj} \rho = 5.17 \text{ г/cm}^3; g = 980 \text{ cm/cek}^2$$

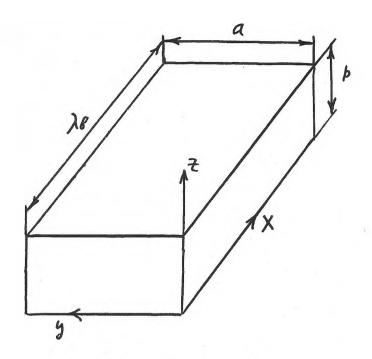


Рис.З. Резонатор  $H_{IOI}$ 

#### в) Влияние фиктивных магнитных отображений

Рассмотрим влияние полюсных наконечников на однородность поля  $\mathcal{H}_{\mathcal{A}}$  когда в зазор между ними помещен образец сферы монокристалла (рис.4). Это влияние приближенно учитывается путем введения фиктивных магнитных моментов (метод зеркальных отображений). Такое приближение справедливо при  $\mathcal{M} \longrightarrow \infty$  (здесь  $\mathcal{M}$  -магнитная проницаемость материала, из которого изготовлены полюсные наконечники). Это приближение в сильных полях на выполняется из-за заметного насыщения полюсных наконечников. В нашем случае полюсные наконечники достаточно далеки от насыщения. Мы учтем только первые, фиктивные отображения, вклад других будет мал (  $\sim 1/2^{\frac{1}{2}}$ ). Учитывая граничные условия

В первом приближении имеем

$$d = \frac{1}{4} \left( \frac{d}{2} \right)^{3} \left[ \frac{1}{(b-2)^{4}} - \frac{1}{(b+2)^{4}} \right] 4 \pi M_{o}$$

где d - диаметр образца.

Для зазора 2  $\delta$  = 40;20 мм, Z= I мм; d = I мм  $4 \pi M_0 = 1750 \,\mathrm{rc}$ .

пол учим

 $a \simeq 1.37; 43.8 \cdot 10^{-4} \)/\text{MM}$ 

Соответственно (I.8) f мах  $\approx 0.2$ ; 6.4.

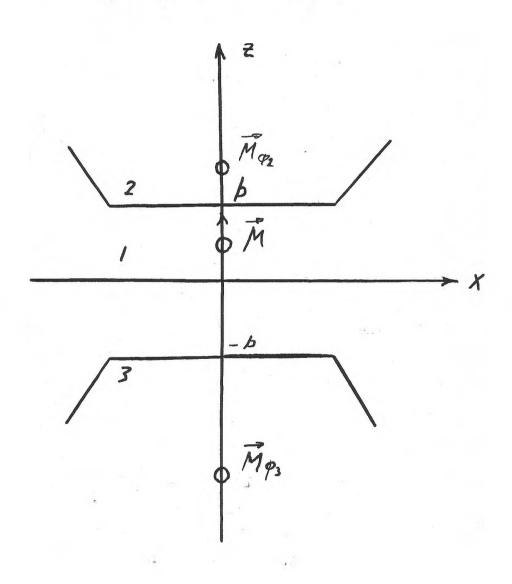


Рис.4. Влияние полюсных *наконечнико*в на одно*род*ность *H*.

# § 3. Учет влияния кристаллографической анизотропии на свойства НФМР

Затягивание по полю области возбуждения МАР I I или что то же самое, но более подробно изученное, явление гистерезиса возбуждения МАР по полю I I можно объяснить на основании влияния кристаллографической анизотропии (KA) и МРС.

Независимо от физической природы КА, можно для каждого типа кристаллической решетки, записать выражение для энергии магнитной КА в виде степенных рядов по составляющим намагниченности [II]. Для монокристаллов  $L_3$   $Fe_5$   $C_{12}$  кубической сингонии, выражение для энергии анизотропии обычно записываются в виде:

 $V_{\alpha} = K$ ,  $(J,J_1+J_2J_3+J,J_3)+K_2J_1J_2^3+$  где  $J_1,J_2^3$  - косинусы углов, образуемые вектором M с осями 4-го порядка. Константы  $K_{I,2}$  имеющие размерность плотности энергии называются константами анизотропии. Учет  $V_{\alpha}$  в уравнении Блоха приводит к зависимости частоты  $\Phi$ MP от ориента ции поля H относительно кристаллографических осей (табл. I)/I

Таблица I Частоты ферромагнитного резонанса в сфере из кубического кристалла.

Направление Н	0	wly
< 100>	0	H + 2 HAI
<1117	5444	H- 4/3 HAI - 4 HAZ
<110>	90°	V(H-2HA)(H+HA)+ 1/2 HAZ)

где 
$$H_{A_1} = \frac{k_1}{M_0}$$
;  $H_{A_2} = \frac{k_2}{M_0}$  — поля анизотропии  $<$  — кристаллографические оси  $\theta$  — угол между  $H$  и  $< 1007$ 

Для монокристаллов  $\frac{y}{3}$   $\frac{F_{e}O_{r}}{2}$   $\frac{H_{A}}{2}$   $\frac{H_{A}$ 

$$Hpeg = \frac{\omega}{r} - \frac{4}{3} |HAI|$$

В[II] считалось, что  $M_2 \approx M_0$ , тогда  $H_{AI} = \frac{K_I}{M_0}$ . Для НФМР это не выполняется, и мы сделаем допущение:

Тогда получаем:

$$Hpeg = \frac{\omega}{3} - \frac{4}{3} |H_{AI}| \frac{M_2}{M_0}$$
 (I.9)

но из формулы (1.5) следует:

$$\frac{\Delta M_{2}}{M_{0}} = \frac{M_{0} - M_{2}}{M_{0}} = \frac{h^{2}}{h^{2} + \Delta H^{2}}$$
 (I.10)

Следовательно, при подходе к резонансу со стороны меньших полей из формул (I.9) и (I.10) следует затягивание резонанс ной кривой, при подходе со стороны больших полей происходит срыв (см.рис.5).

При ориентации образца по оси трудного намагничивания < 100

$$Hpeg = \frac{\omega}{f} + 2|H_{AI}| \frac{M_{\pm}}{\mu_0}$$

т.е. картина будет обратной.

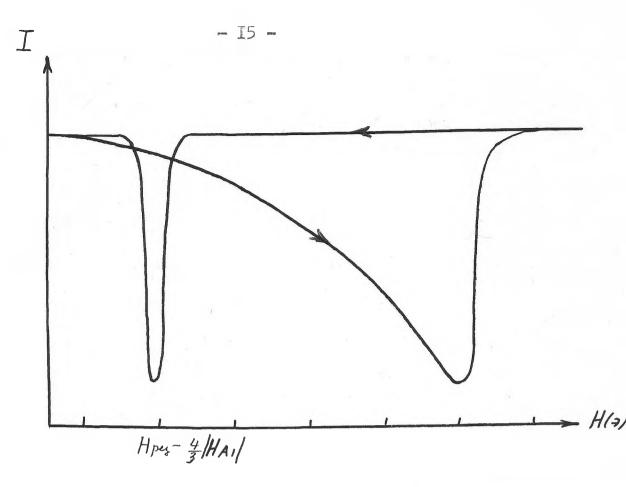


Рис.5. Гистерезис кривой поглощения, обусловленный влиянием кристаллографической анизотропией I—интенсивность отраженной волны.

Для незакрепленного образца, помещенного в пробирку, воздействие МРС и КА может привести к повороту сферического образца на месте, либо к качению по полусфере дня пробирки. Образец "постарается выйти" из условий магнитного резонанса, так как энергия его резко увеличивается при ФМР. В том и другом случае это произойдет за счет поворота образца. Это приведет к увеличе нию резонансного поля для любого поворота, т.к. для монокристалл величина резонансного поля минимальна для  $\widehat{H}$ параллельного оси намагничивания. Следовательно, при наблюдении НФМР резонанса в сторону увеличения поля и происходит затягивание срыв для обратного направления. На основании сказанного, величин ватягивания по полю при повороте образца  $\widetilde{H}$  Hмаксимального F111 трудной будет легкого намагничвания к

\$ HAIL+2 HAIL= 1337 gas HAIL= 407.

#### § 4. Учет нагрева образца

При резонансе колебания магнитной системы неизбежно связаны с диссипацией энергии, то есть передачи ее другим системам, в конечном счете кристаллической решетке. Наличие диссипации приводит к тому, что вынужденные колебания имеют конечную амплитуду при резонансе и конечную ширину резонансной кривой. Диссипация энергии приводит к разогреву образца, что влечет за собой изменение магнитных характеристик вещества (см.рис.6,7).

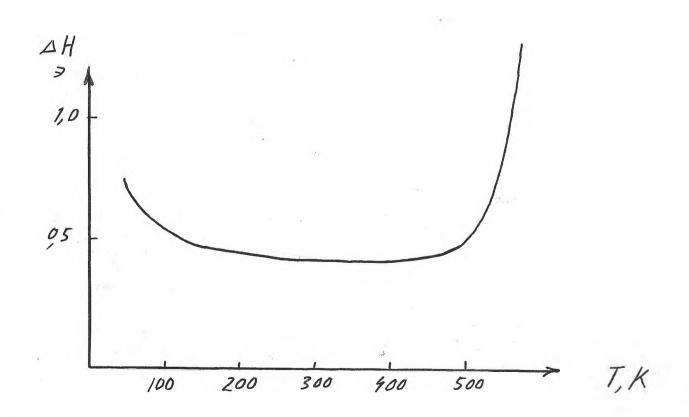


Рис.6. Зависимость ширины линий ФМР сферического образца монокристалла  $I_3$   $F_{e_5}$   $O_{p_2}$ от температуры I 13 I.

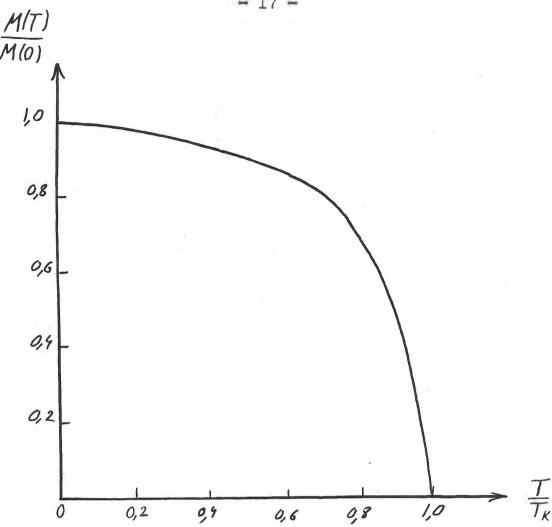


Рис.7. Температурная зависимость намагниченности железа [14].

Найдем зависимость температуры от радиуса образца и времени нагрева для сферического образца монокристалла, имеющего тепловой контакт через поверхность с воздухом. Для этого нужно решить уравнение теплопроводности.

Будем полагать  $\mathcal{H}=const$ , тогда достижение равновесного состояния будем описывать приближенно функцией [15]

$$T = T(z,t) = T_0[z] \left(1 - e^{-t/z}\right) \quad {236}$$

$$T = \frac{a^2 pc}{V} \qquad (I.II)$$

где а - радиус сферы;

Р - плотность;

с - теплоемкость;

 $K_{7}$  - коэффициент теплопроводности

Для монокристалла  $Y_3$   $Fe_5$   $O_{72}$  с  $C = 0.5.10^{-1}$  см  $\rho = 5.17$  г/см<sup>3</sup>,  $K_7 = 3.10^{-2}$   $\frac{\text{дж}}{\text{см.сек.град}}$  , C = 0.65  $\frac{\text{дж}}{\text{г.}}$  C = 0.65 C =

В настоящей работе время развертки менялось ( I \* 300 сек.) по полю I30 ); следовательно, время нагрева, при ширине линии  $2\Delta H = 0.2$  э будет порядка  $t_{\mu\alpha\gamma\rho} = 0.0015 \div 0.46$  сек. Поэтому для оценок будем считать, что окружающая среда — воздух не успевает нагреться и находится при температуре  $T_{\rm комнатной}$ . Тогда для шара из твердого материала  $0 \le Z = \alpha$ , в котором в единицу времени на единицу объема выделяется постоянное количество тепла  $A_c$ , решение для  $T_c(z)$  имеет вид [15].

$$T_0(z) = \frac{A \circ a^2}{6 \, K_T} \left[ 1 - \left( \frac{2}{a} \right)^2 \right] + T_{XAUH}.$$
 (229)

Для определения А воспользуемся теоремой Умова-Пойтинга [ II ] для среднего значения мощности потерь:

$$\overline{P} = -\frac{\omega}{2} \operatorname{Im} \left( \overline{h} \cdot \overline{m} \right). \tag{I.12}$$

В нашем случае с учетом резонанса:

TO (I.5)
$$A_0 = \frac{1}{4} \left( 4 \pi M_0 \right) \frac{\Delta H}{1 + \frac{\Delta H^2}{h^2}} \cdot f$$

соответственно

$$T_{o}(z) = \frac{1}{24} \frac{4\pi M_{o}f}{k_{\tau}} \cdot \frac{\Delta H \cdot a^{z}}{1 + \Delta H^{2}/h^{2}} \cdot \left(1 - \frac{z^{z}}{a^{z}}\right) + T_{K}$$
Для монокристаллов

для 
$$h = 0.1 \Delta H$$
,  $T_o = \{5 \mp (1 - 2 \% a^2) + 20 \}^\circ C$   $h = 0.5 \Delta H$ ,  $T_o = \{1140(1 - 2 \% a^2) + 20 \}^\circ C$  Тогда для оценки в общем случае имеем формулу:

$$T(z,t) = \int_{24}^{1} \frac{4\pi N_0 - f}{R\tau} \cdot \frac{\Delta H - a^2}{1 + \frac{\Delta H^2}{h^2}} \left( 1 - \frac{z^2}{a^2} \right) + T_k \left[ 1 - e^{\frac{t}{a^2} pc} \right] (I.I3)$$

Следовательно, форма резонансной кривой будет сильно зависеть от времени развертки и мощности СВЧ, вследствие зависимости  $\mathcal{M}_{\mathfrak{o}}$  от  $\mathcal{T}$  и соответственно  $\mathcal{H}_{\mathcal{A}_{\mathfrak{f}}}$  от  $\mathcal{T}$  .

## ГЛАВА 2. РАСЧЕТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА РАБОТЫ НА НЕЙ

При изготовлении установки мы руководствовались концепцией магниторезонансной силы при НФМР и нашими возможностями по выбору имеющейся измерительной аппаратуры на кафедре. В результате этих причин константирование факта и оценка нижнего порога величины МРС проводились по наблюдению разрыва двух магнитных диполей при прохождении линии НФМР, а выяснение роли МРС проводилось путем сопоставления наблюдений пространственных перемещений образцов в пробирки и одновременного возникновения искажений формы линии НФМР.

В остальном же для облегчения сравнимости результатов измерений данной работы с работами [1,2] и их совместной интерпретации на основе концепции МРС, измерения по НФМР и МАР проводились в аналогичных режимах.

#### § I. <u>Блок-скема установки</u>

В блок-схеме установки (см. рис. 8) можно выделить системы:

- I) Управления полем -
- 2) CB4,
- 3) Наблюдения и записи линий поглощения
- 4) Наблюдения МАР.
- І. Система управления полем.

Система управления полем служила для получения динамичесского диапазона по полю, необходимого для исследований. Величина этого диапазона с учетом явления гистерезиса по КА составляла

Homin - Homas

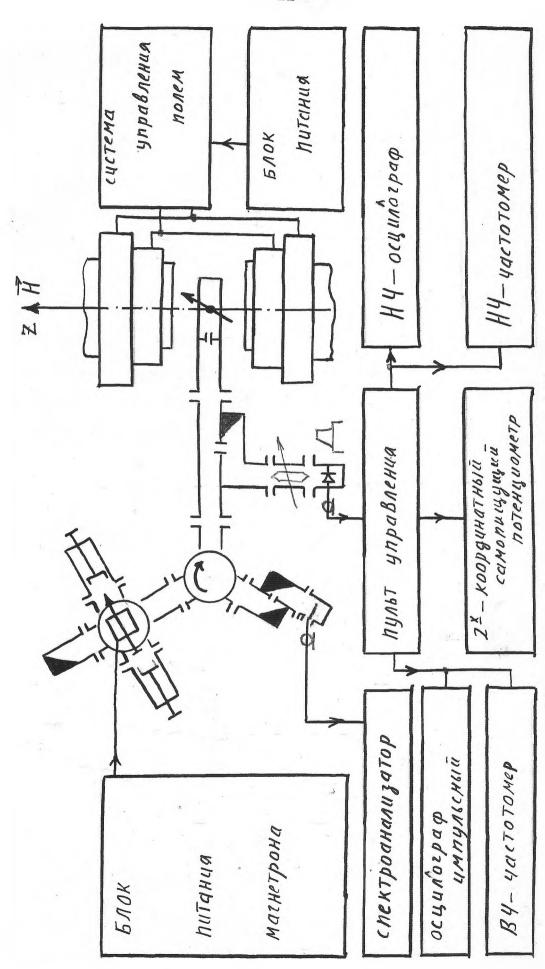


Рис. 8. Блок-схема экспериментальной установки.

где

$$H_{omin} = 4/(s/2\pi) - \frac{4}{3}|H_{AI}|$$
 (2.1)  
 $H_{omax} = 4/(s/2\pi) + 2|H_{AI}|$  (2.2)

Величина же поля, получившаяся в зазоре постоянноро магнита в результате подгонки и шлифовки полюсных наконечников составляла

где *а* - горизонтальный градиент в центральной области между полюсными наконечниками.

Величина развертки , рассчитанных и изготовленных катушек Гельмгольца составляла  $H_{I}=\pm$  (0 ÷ I38 )э  $K_{I}=276$  э/а

где К, - коэффициент катушек с калибровкой по току.

Для смещения точки  $O = (\gamma H_{\theta} - \omega)$  служили сдвиговые катушки с характеристиками

$$H_2 = \frac{1}{2} (0 \div 25) a$$
 $K_2 = 50 a / 1000 e g$ 

Прохождение динамического диа пазона обеспечивалось автоматически, с подачей пилообразного напряжения на систему управления полем от осцилографа С I-54, с временем развертки от 0 • 300 сек, и вручную. Величина поля измерялась инллиамперметрами с классом точности I, время развертки-по частотометру 43-35A.

Принципиальная схема разработанной системы изображена на рис.9. Сопротивления R, R, и R, R, служат для регулировки диапазона развертки в ручном и автоматическом режимах.  $\mathcal{D}$ , с и  $\mathcal{D}$ , для защиты транзисторов и катушек Гельмгольца, соответственно. Использование переключателя  $\mathcal{D}$ , позволило упростить процесс измерения с разверткой по полю и против поля. В качестве источников стабилизированного напряжения применялись "Александрит со стабильностью  $\frac{\mathcal{L}\mathcal{L}_{\text{RECLY}}}{\mathcal{L}_{\text{RECLY}}} = 10^{-4}$ , которые, в свою очередь, запитывались от прецизионного стабилизатора напряжения переменного тока —  $\mathbb{I}$ — $\mathbb{I}$  С

Калибровка подмагничивающих катушек проводилась по  $\Phi$ MP, поэтому погрешность измерения по полю катушек в основном определялась погрешностью приборов. Поле  $\mathcal{H}_{oM}$  определялось из формулы (2.I) по известной  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{H}_{AI}$ , что справделиво для незакрепленных образцов.

#### 2. Система СВЧ

В качестве источника СВЧ применялся магнатрон с  $\mathcal{L}=9.422$  Мгц. Мощность СВЧ поля, подаваемая в резонатор с типом волны  $\mathcal{H}_{lol}$  (см.рис. IO), менялась с помощью поляризационного аттенюатора,  $\mathcal{L}_{p}$ адуировочные графики которого представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Градуировочные графики.

40	0	1	2	3	4	5	6	7	9	12	15	18	22
(P/P) 25	0	~ 0	4,5	7,45	9,90	174	12,8	13,4	15,3	16,7	17,7	18,5	19,4
pmlm	0	1	6	12	20	29	38	45	68	97	121	196	177

# Продолжение Таблицы 2.

T)	Y	поляризационного	
	TITE OF COURTERS		omma mao mano
I DELL VALIDEDUSE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11046140661406614	

20	27	34	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92
(p/PKEA)	20,2	20,8	21,4	21,6	22,0	22,2	22,5	22,9	23,1	23,6	23,8	29,9	24,9
Puli	212	257	289	299	321	342	367	390	921	472	495	561	627
					,	,							
po	97	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	143,
PIPKAN	97 25,6	102	107	112	117 28,2	122 29,5	127	132 30,5	137	142	147 31,4	152 368	143, 31,5

Для предотвращения эффекта затягивания частоты магнетрона отраженной волной использовался ферритовый циркулятор.

Для питания анода и накала магнетрона применялись стабилизированные источники нитания. Для стабилизации тока магнетрона была собрана схема (см. рис. II), где в качестве опорных напряжений -600, 400, 300,  $\sim$  I2,6;  $\sim$  220 в применялись источники

$$9 N \Pi - 1 \ c \ K_c = \begin{cases} 5.10^{-2} & \text{для 600, 400в} \\ 1 & \text{для } \sim 12,6 \ \text{в} \end{cases}$$

Напряжение от 0 • 400 в служило для плавной регулировки тока магнетрона. Отраженный сигнал от резонатора через направленный ответвитель и аттенюатор подавался в детекторную секцию. Переменный аттенюатор предохранял детектор от перегрузки при больших уровнях мощности сигнала. Настройка резонатора производилась по мой коэффициента отражения при помощи изменения вели-

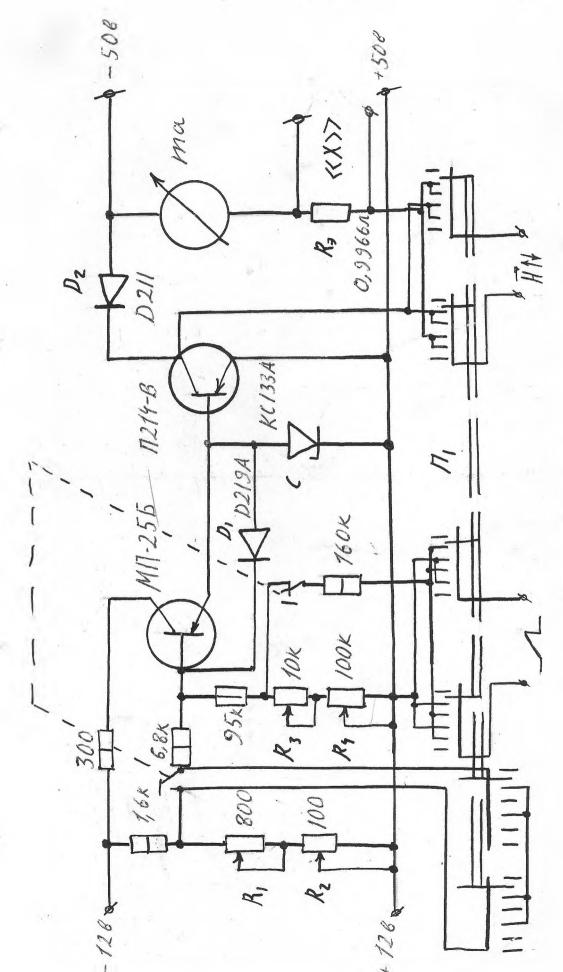


Рис.9. Схема блока управления по полю.

чины связи лопаточкой-I ( рис. IO) и изменения  $\lambda_p$  резонатора винтом-2. Запредельные волноводы-3 служили для смены образцов и визуального наблюдения за поведением образцов. Измеренная добротность резонатора составляла  $\mathcal{Q}_{\bullet} = 1000$ .

### 3. Система наблюдения и записи линии поглощения

При временах развертки  $\mathcal{T} \gg I$  сек линия поглощения НФМР записывалась на двухкоординатном самопишущем потенциометре ПДС-02ІМ с классом точности І (для времени прохождения кареткой всей длины шкалы не более: по оси  $\ll \mathcal{Y} \gg -1.4$  сек, по оси  $\ll \mathcal{Y} \gg -1.4$  сек, но оси  $\ll \mathcal{Y} \gg -1$  сек). На вход оси  $\ll \mathcal{Y} \gg -1.4$  сек, величина развертки по полю в единицах тока с  $\mathcal{R}_{\mathfrak{F}}$  эталонного (рис.9). На вход оси  $\ll \mathcal{Y} \gg -1$  подавался сигнал пропорциональный интенсивности отраженной волны непосредственно с детектора  $\mathcal{A}_{\mathfrak{F}}$  (рис. Наблюдения по ПДС-02ІМ дублировались на низкочастотном осциллографе СІ-4 с диапазоном от 0, I +100000 гц. При временах развертк  $\mathcal{T} \ll 1$  сек линия поглощения НФМР наблюдалась по осциллографу СІ-4.

### 4. Система наблюдения МАР

Наблюдение МАР проводилось по спектру отраженной волны на анализаторе спектра частот 3-х сантиметрового диапазона волн ИВ- (с характеристиками:  $\lambda = 3.I - 3.4$  — диапазон волн прибора,  $\Delta f = 0.06$  Мгц — разрешающая способность на частоте), и по наблюдению акустических колебаний на импульсном осциплографе СІ-54 (с характеристиками:  $0.003 \div 10.000.000$  2%, диапазон частот).

Частота акустических колебаний измерялась по цифровому частотометру 43-35 A, диапазон измеряемых частот которого

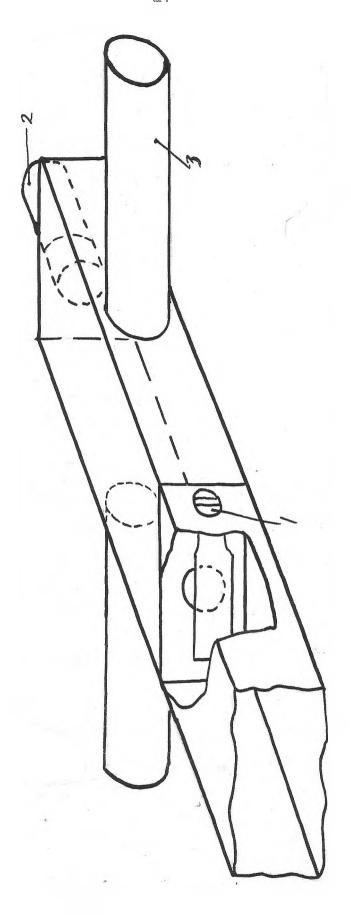


Рис.IO. Конструкция резонатора.

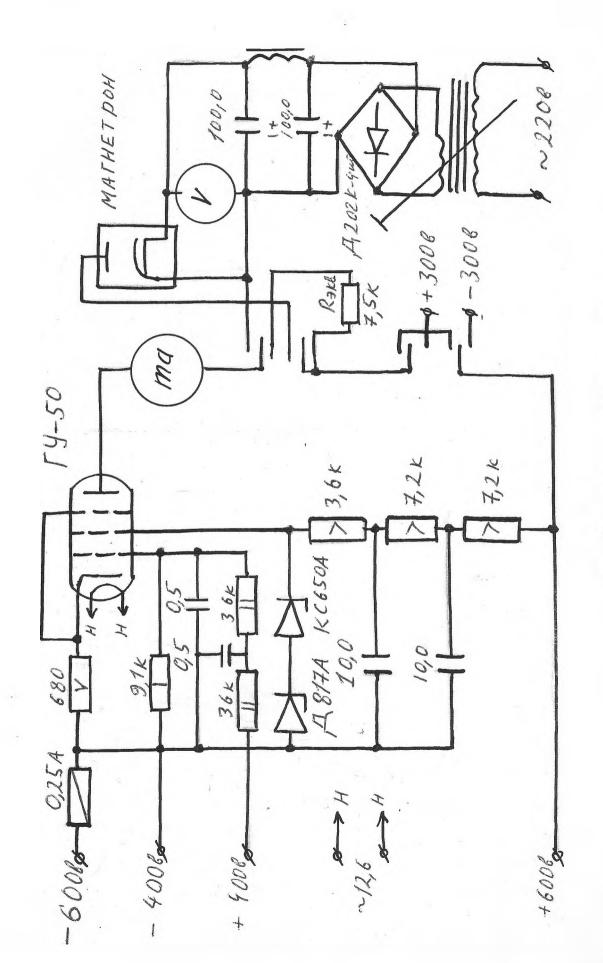


Рис. II. Схема питания магнетрона.

IO • 55000000 гц, точность измерения частоты  $\delta_r = \frac{\Delta^4}{4} = 0.8.10^{-7}$ . Частота НЧ пульсации МАР измерялась по цифровому частотометру Ф599, диапазон измеряемых частот жоторого 0,1 - 1500000 гц, измерения частоты  $\delta_r = \pm 1.10^{-6}$ . Появление МАР сопос тавлялись с изменением формы резонансной кривой, записанной на ПИС-02IM .

### § 2. Образцы используемые в эксперименте и методика работы с ними

Для опытов использовались образцы монокристаллов  $Y_3$   $F_{e_5}$ в виде отпалированных сфер, аттестованных в Ленинграде, характеристики которых приведены ниже

Таблица З . Параметры образцов,

Nº ospazua	d,	de	ds	dq	ds
quaremp d(un)	1,34	0,97	0,775	0,635	0,410
ширина линии 2 ДН (э)	0,23	0,49	055	0,55	056

I. Поле анизотропии  $\mathcal{H}_{Al}$  :

2. Намагничен ность насыщения ( $\pm 30$ ) при 20°С 4 $\pi M_{\odot}$ :

3. Температура Кюри (±3)

2830

4. Πποτηοςτь (± 1%) ρ :

5,17 r/cm

5. Удельное электросопротивление (±10%) в ом.см 2.10<sup>13</sup>

6. Класс обработки 14, отклонения от сферичности 0,5.

При измерениях образцы помещались в центр резонатора, где отсутствовал нагрев образцов, обусловленный электрическими компонентами СВЧ поля, вследствие равенства их нулю.

Наблюдение линии НФМР проводилось на образцах помещенных свободно в пробирку и на образцах закрепленных в щели деревянной полочки (рис. I2)

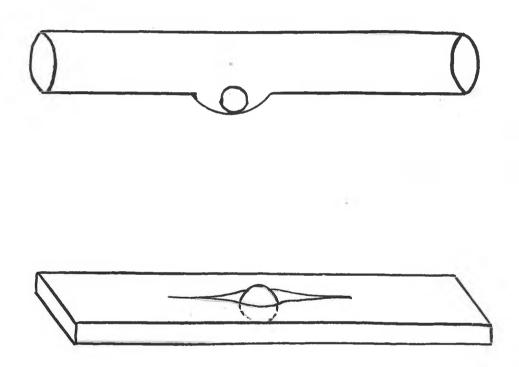


Рис. 12 Крепление образцов

#### ГЛАВА З. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА.

## § I. Измерение нижнего порога величины магниторезонансно силы по разрыву двух диполей.

Найдем силу притяжения между двумя сферическими образцами монокристалла  $I_3$   $F_{e_5}$   $O_{12}$  , помещенных в поле  $\overline{H}$  . В первом приближении будем считать, что у нас имеются два точечных магнитных диполя с моментами  $\overline{M}_{1,2}$ 

где  $M_0$  - намагниченность насыщен ия  $M_0$  ffH  $Z_{1,2}$  - радиус монокристалла с  $M_{1,2}$ 

находящихся на расстоянии  $7, +7_2$ . Тогда величина силы необходимая для разрыва двух диполей должна быть, пожрайней мере, больше силы дипольного притяжения. Вычисления силы дипольного притяжения силь дипольного притяжения относительно к силе тяжести двух образцов приводят к формуле:

| Fgun | FT | = (471 Mo) 2 (7,72)3 | (7,12) 4(7,3+723).271.99

В эксперименте при СВЧ мощности порядка 500 мвт два магнитных диполя с 2  $Z_{1,2} = 0.775$ ; 0,441 мм при резонансе разрывало и разносило в разные стороны. Из этого наблюдения следует, что величина МРС, ппо крайней мере

в 32 раза больше силы тяжести двух диполей.

# § 2. <u>Механизм возбуждения магнитоакустических</u> колебаний

Вкратце остановимся на механизме возбуждения МАР [10, 13]. В ферромагнитном кристалле, как и в других твердых телах, могут существовать упругие колебания и волны. Благодаря эффекту магнитострикции возникают колебания решетки. В монофисталлах же ферритов, спиновые волны (магноны) связаны спин-решеточным взаммодействием с колебаниями кристаллической решетки (фононами). В результате чего происходит возбуждение МАР. Для описания магнитоакустических колебаний в уравнение движения намагниченности добавляют член, учитывающий силу — действующую на единицу объема кристалла, обусловленную магнитострикцией.

Мы же сразу полагаем, что сила F - это магниторезонансная сила. Объясним с этой позиции НЧ-пульсации МАР, возникающие в результате пространственных колебаний образцов по полусфере дна пробирки ( Рис. 13).

Образец под воздействием МРС начинает катиться по дну пробирки, при этом меняется величина *Нрез* за счет изменения ориен тации осей кристаллографической анизотропии по отношению к внешнему полю. В результате образец периодически получает толчки при попадании в условия НФМР.

Тогда в первом приближении, ввиду малости размеров образцов 2z << 2R, где R -радиус дна пробирки можно получить модель маятника с длиной "нити" - (R-2). Частота собственных колебний такого маятника для R=4 мм, z=0.388 мм будет:

$$f_{07e_{0}} = \frac{1}{2\pi} / \frac{9}{P-7} \approx 8 \text{ FL} \quad (3.1)$$

Небольшое расхождение между  $f_{oreg} = 8$  гц и  $f_{oreg} = 9 \div 20$  гц можн объяснить тем, что при вычислении  $f_{oreg}$  не рассматривался вклад вынужд**и**ющей силы — MPC.

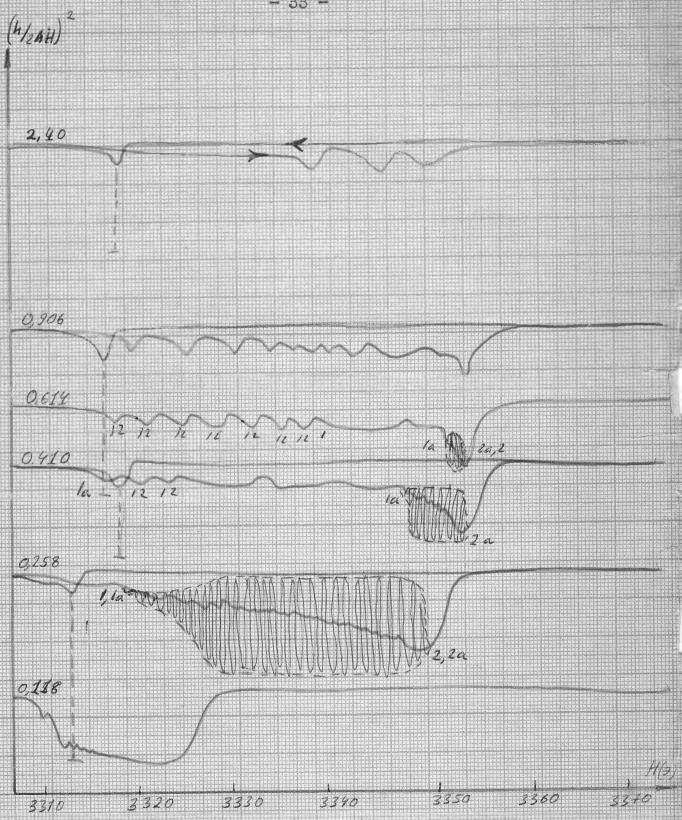
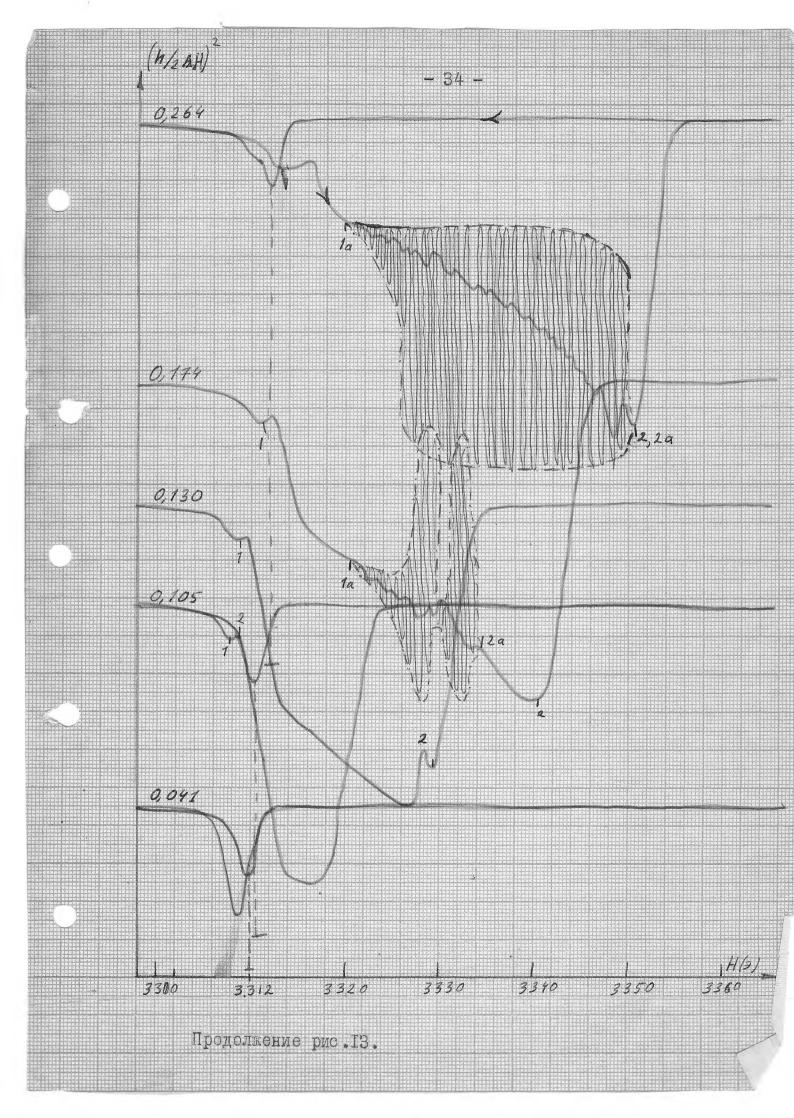


Рис. 13. Графики формы линии поглощения, при различных нормированных мощностях наначки,  $\mathcal{Z}_{pay} = 10$  сек.,  $d_3 = 0,775$  мм незакреплен  $2\Delta H = 0,55$  э; I-2 - область возбуждения МАР,  $f_a = 6,640$  Мгц, Ia-2a - область НЧ-пульсаций МАР 1<sub>114</sub> = 9 ÷ 20 гц → направление развертки.



В результате НЧ-пространственные колебания приводят к периодическому срыву возбуждения МАР – НЧ — пульсациям МАР, замеченные также в работе [2].

На основании изложенного можно предложить модель возбуждения мАР — возникновение МРС и нестабильностей некоторых параметров НФМР (  $\not$  примеру  $f_{(B2)}$ ,  $h^2$  и т.д.) приводит к возбуждению периодической упругой силы, которая за счет магнитоупругого взаимодействия, в свою очередь, приводит к возбуждению магнитоакустических колебаний.

## § 3. Гистерезис НФМР

В работе [2] гистерезис возбуждения МАР объясняется возникновением  $\delta H_{2}qqq < O$  приводящее к

где бнадар - считают обусловленно магнитострикцией.

Мы объясним результаты данной работы ( рис.13  $\div$  14), подтверждающие результаты работ [1,2], не основе предложенного механизма возбуждения МАР ( § 2, гл.3) и влияния кристаллографической анизотропии (§ 3, гл.1).

В результате влияния кристаллографической анизотропии линия поглощения НФМР на незакрепленном образце будет иметь вид (рис.15 см. § 3 гл.1).

Но магниторезонансная сила фактически — это производная от линии поглощения (16), тогда на основании рис. 15 ее можно апроксимировать в виде рис. 16.

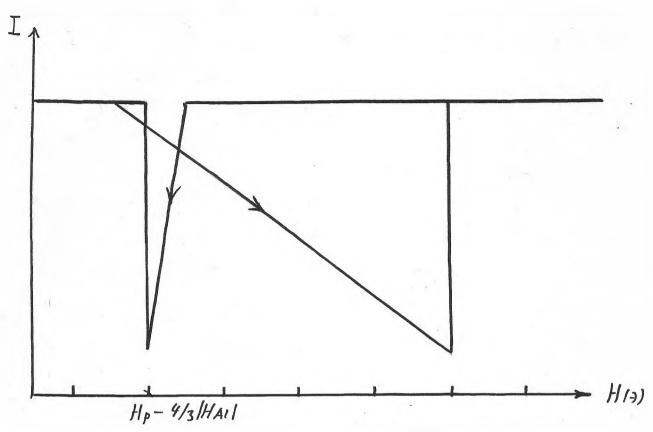


Рис. I5. Линия поглощения НФМР на незакрепленном образце.

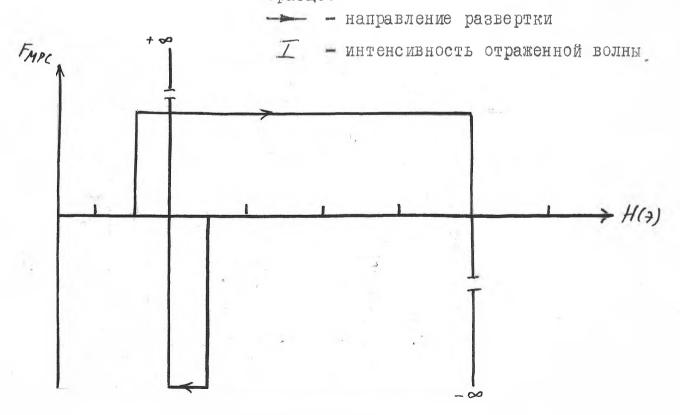


Рис.16. Гистерезис МРС направление развертки.

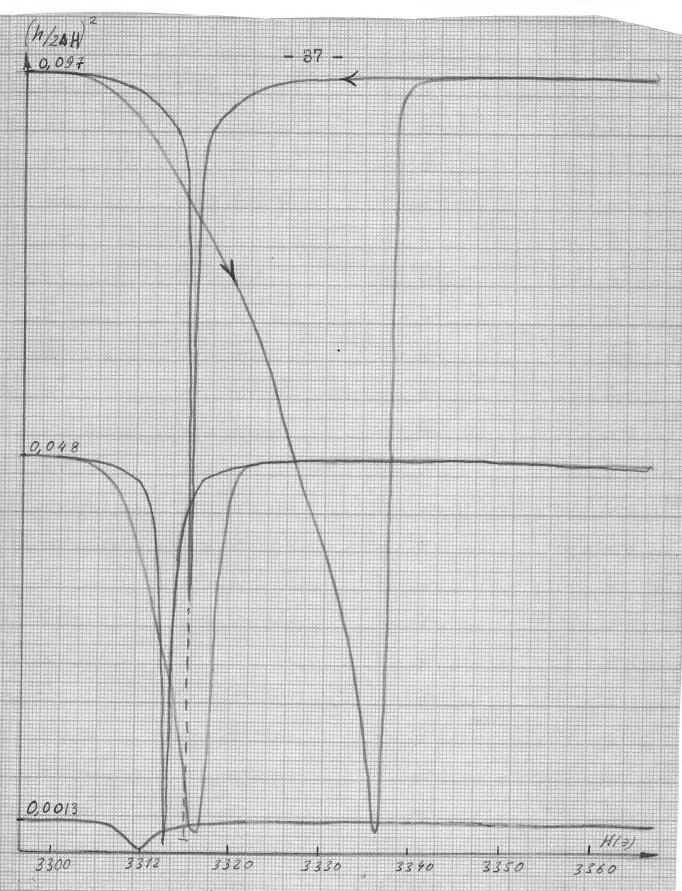
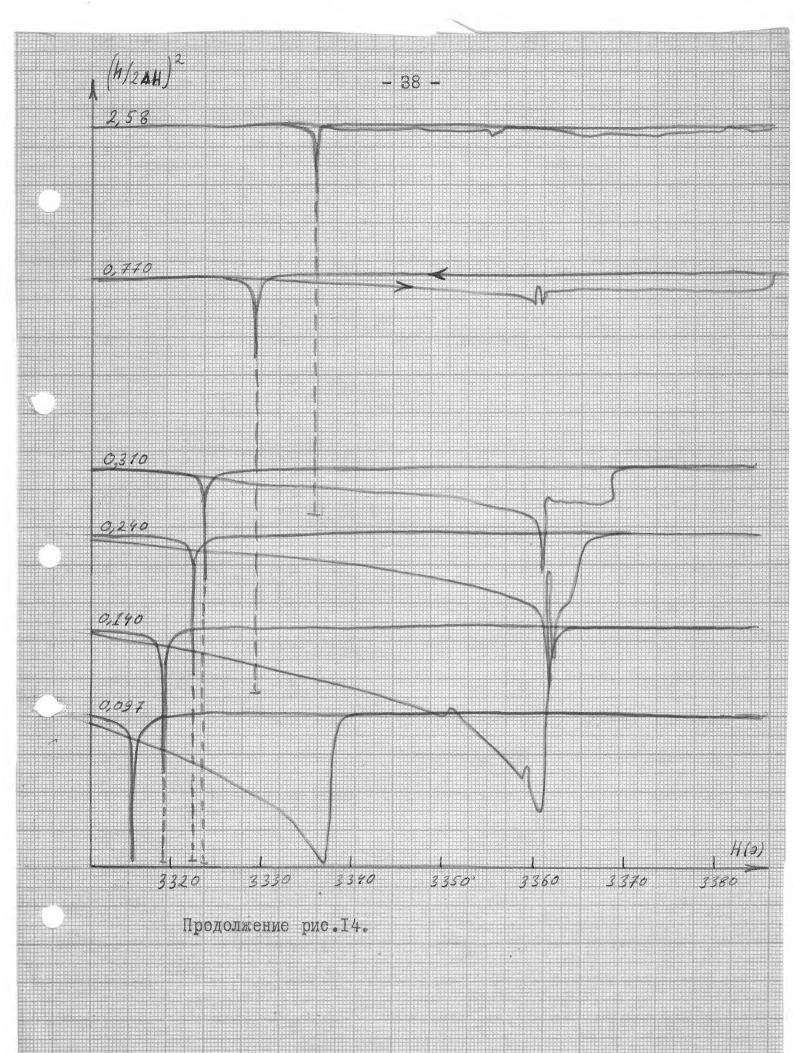
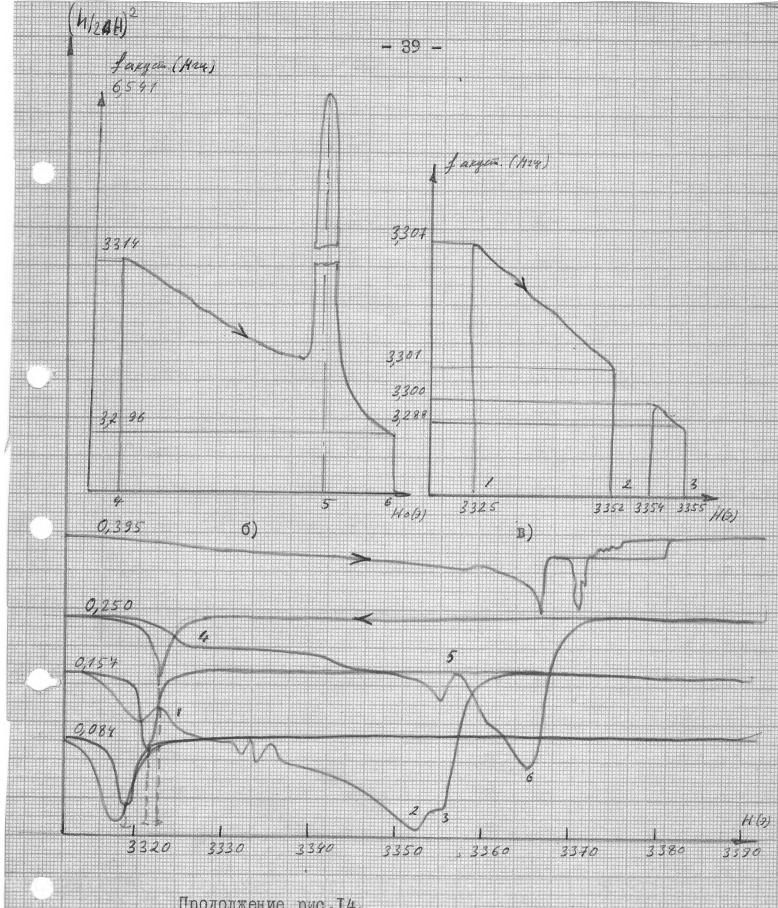
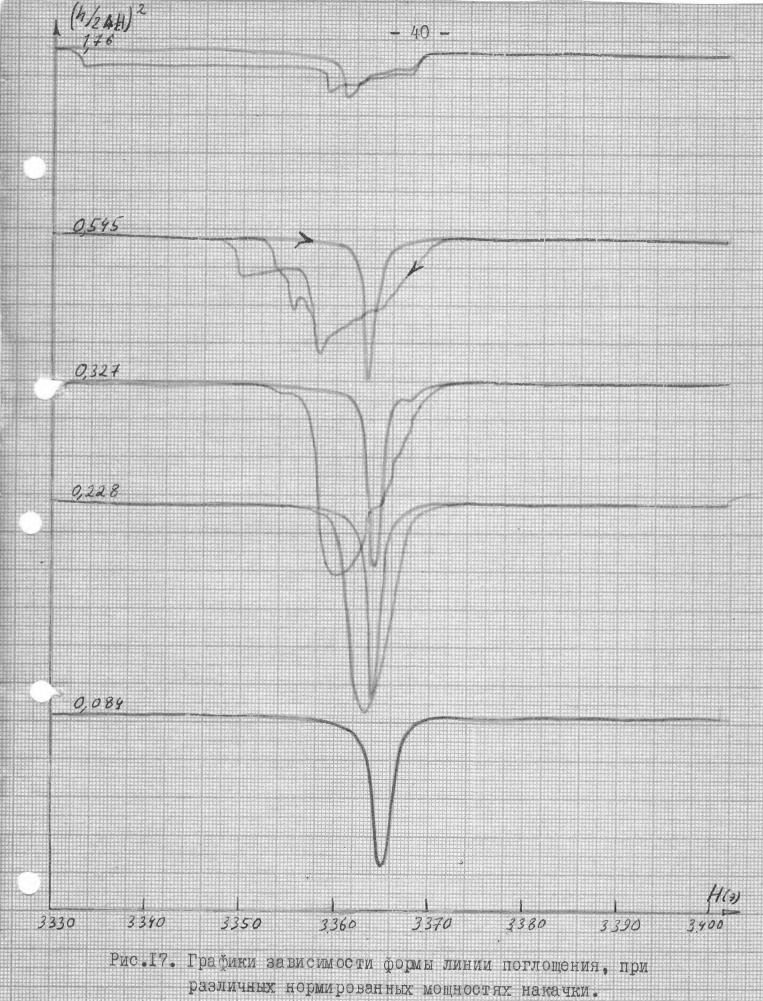


Рис. I4. Графики формы линии поглощения, при различных нормированных мощностях накачки,  $\mathcal{I}_{PGG} = 190$  сек,  $\mathcal{I}_{AG} = 0.775 200$  незакреплен,  $\mathcal{I}_{AH} = 0.55$  э направление развертки.





Продолжение рис. I4.
б, в - график зависимости  $f_{arger}$  от подмагничивающего поля для областей (4-5-6) (I-2-3).



различных нормированных мощностях накачки. Тризе = 38 сек, Из = 0,775 мм - закреплен, 21 4 = 0555 \_\_\_ направление развертки.

Тогда взяв в основу модель возбуждения МАР, предложенную в § 2 гл.3, мы видим, что при прохождении линии НФМР в сторону увеличения поля область возбуждения МАР по величине будет большчем область в сторону уменьшения поля. Для закрепленных образцов возбуждения МАР не происходило. (Рис. 17).

## § 4. <u>Зависимость формы линии поглощения **эт** времени</u> развертки по полю

Зависимость формы линии поглощения от времени развертки по полю  $T_{page} = I \div 300$  сек при временах релаксации  $T_z \approx 10^{-6}$  сек, можно объяснить воздействием MPC и нагревем образца (рис.18, 19).

Для времени прохождения линии НФМР ( t него =0,0015+0,46сек см. § 4, гл. I).

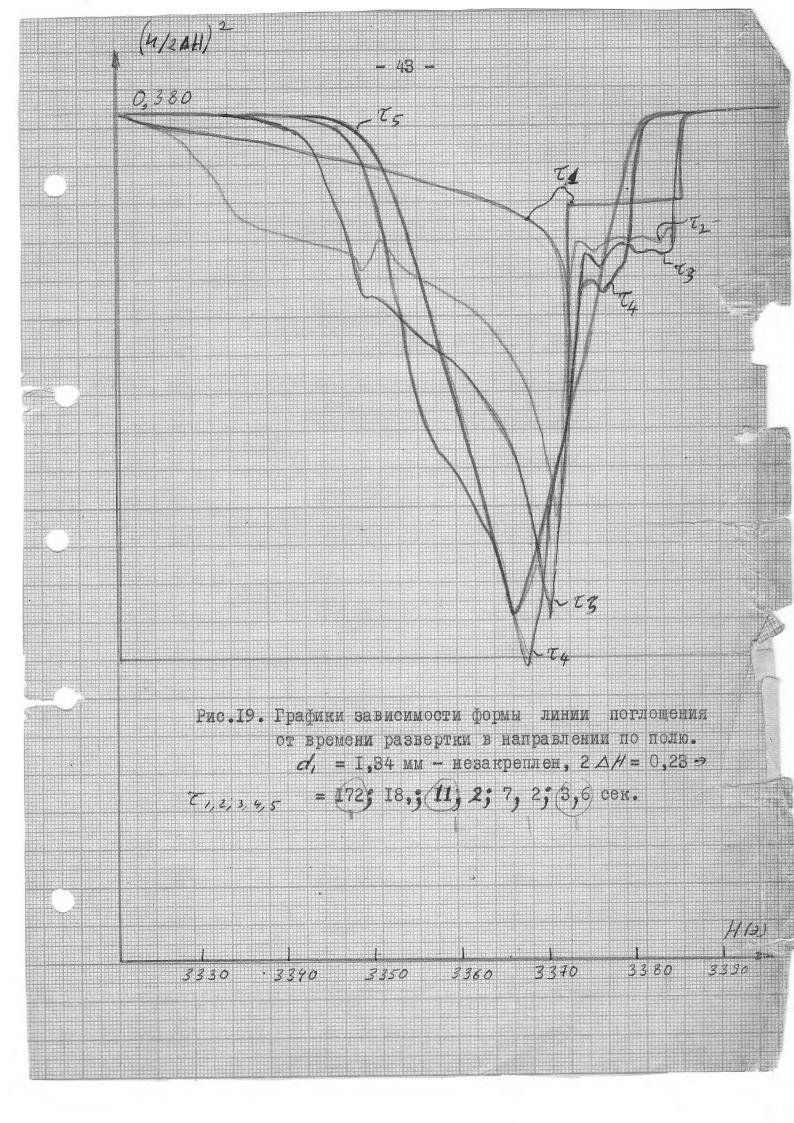
где  $Z_{\tau}\approx 0.3$  сен — время выхода на стационарный режим температуры (I.II),

$$T_{A} = \sqrt{\frac{R-7}{g}} \approx 0,02$$
 сек — время механической инертности образца (3.1),

Форма линии НФМР будет приближаться к лоренцевой, что подтверждают данные эксперимента (рис.18.19).

При времени прохождения линии НФМР

Форма линии НФМР будет искажена за счет пространственных перемещений образцов и их нагрева.



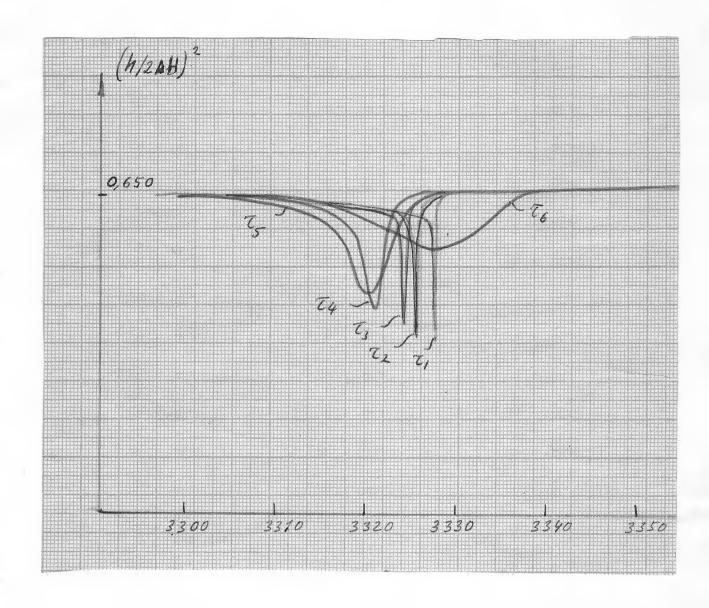


Рис.18. Графики зависимости формы линии поглощения от времени развертки в направлении против поля  $d_3 = 0,775$  мм незакреплен  $2\Delta H = 0,55$  в,  $Z_{12,3,9,5,6} = 300$ ; I20; 60; I2; 3; I, 2 сек.

## 

В настоящей работе учтено влияние неоднородностей по полю;  $H(\tilde{t})$  ведущих к возникновению магниторезонансной силы. Получена формула для выражения MPC.

Экспериментально подтвержден факт наличия большой величины MPC и исследовано ее влияние на свойства нелинейного ферромагнитного резонанса.

- Выяснена физическая причина НЧ пульсаций магнитоакустических колебаний.
- 2. Предложен механизм влабуждения магнитоакустического резонанса.
- 3. На основании влияния MPC и кристаллографической инизотропии объяснен гистерезис возбуждения МАР по полю.
- 4. На основании проведенных оценок времен нагрева и механической инертности образцов предложено объяснение для зависимости формы линии от времени развертк по полю, при больших мощностях накачки.

## JUTEPATYPA

- [I] E. G. Spencer and R.C. Le Craw, Phys. Rev. Lett, 1, No. 7, 241 (1958), E. G. Spencen and R.C. Le Craw, Journ. Арр. Phys., Suppl. to V. 30, № 4, I495 (1959 г.) перевод в [9] ст. 286-295.
- [2] В.Д.Бурков, А.В. Вашковский и В.Н.Кильдышев, ФТТ 10, № 2, 605 (1968 г.); В.А.Бурков, А.В.Вашковский и В.Н.Кильдышев, ФТТ, ТО , № 12, 3735 (1968 г.).
- [3]. А.В. Вашковский, ВИ. Зубков, Р. Г. Кочарян. ЖЭТФ, 66, № I, 274 (1974).
- [4]. В.Л.Гранкин, Г.А.Мелков, С.М.Рябченко. ЖЭТФ, 67, № 6, 2227 (1974 г.).
- [5]. S'ahl H. Journ. Phys. Chem. Sol, 1, 209 (1957).)
  перевод в [9], стр. 163-205.
- 161 А.С.Бакай, В.Г. Барьяхтар ЖЭТФ, 58, № 4, I342 (I970 г.)
- [7] Миронов С.А., Щербаков А.С., Обрубов О.П.
  ФТТ, 17, № 4, 1104 (1104 (1975 г.))
- 181 В.В.Заутнин, В.Е. Захаров, В.С.Львов, С.Л., Мушер, С.С. Старобинц, ЖЭТФ, 62, № 5, I782 (1972 г.).
- Г91. Ферриты в нелинейных сверхвысокочастотных устройствах, Сб. переводов, Ред. А.Г.Гуревич, И.Л. 1961 г.
- 7101 Я.А. Моносов "Нелинейный ферромагнитный резонанс" , Наука, 1971.
- III. А.Г.Гуревич "Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках". Наука, 1973 г.
- [ 12] A. Леше, "Ядерная индукция", И.Л. 1963 г.
- Тізі. Ю.М.Яковлев, С.Ш.Генделев "Монокристаллы ферритов в радиоэлектрониже. М., "Сов.радио", 1975 г.

[14] Б.Лакс, К.Баттон "Сверхвысокочастотные ферриты и ферримагнетики", И. "Мир" 1965 г.

[15]. Г.Карслоу, Д.Егер. "Теплопроводность твердых тел", 1964 г.